

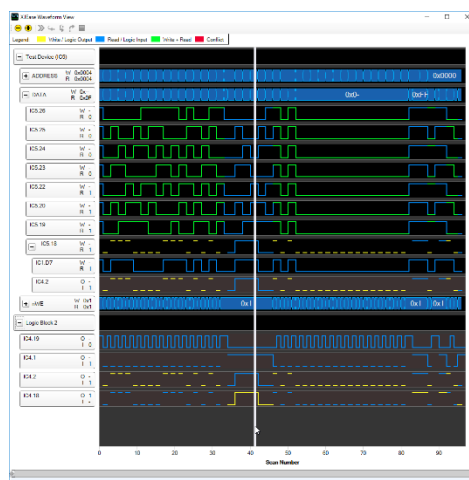


JTAG バウンダリスキャンテストの解析機能を強化

JTAG バウンダリスキャンテストツールの世界的リーディング・サプライヤである XJTAG 社は革新の v3.8 で、スマートなデバッグ、容易なプログラミング、そしてより優れたテストカバレッジ解析を提供します。XJTAG v3.8 で強化された主な解析機能は次のとおりです。

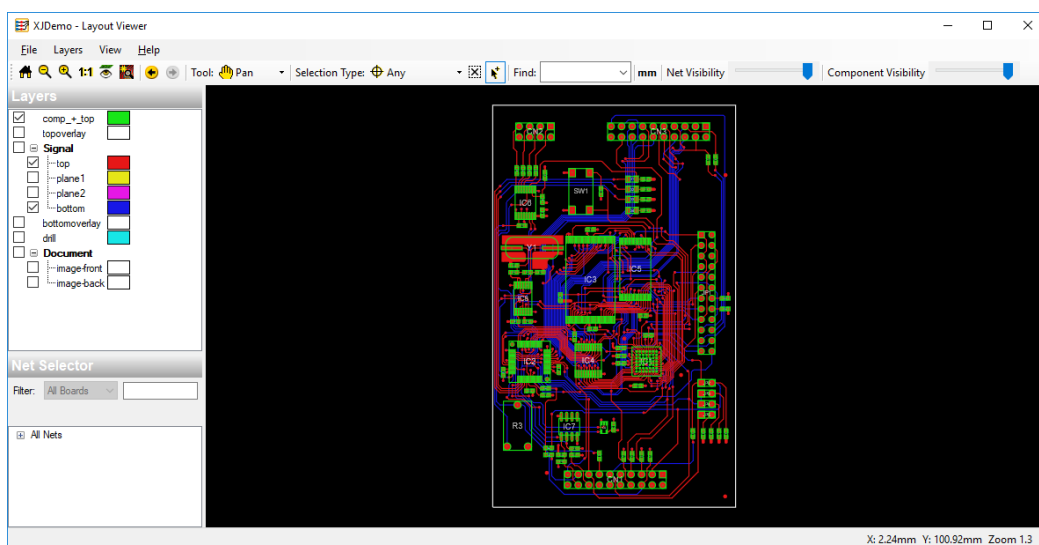
1. Waveform Viewer でデバッグを視覚化

Waveform Viewer は、JTAG バウンダリスキャンテストによる各信号線の制御（読み・書き）を、そしてどのようにしてエラーを検出しているのかを視覚化します。Waveform Viewer に表示される主要ピン値の詳細な波形は、データシートのタイミング図と比較することで、欠陥を診断し、エラーの特定も容易になります。



2. レイアウトビューアの改善

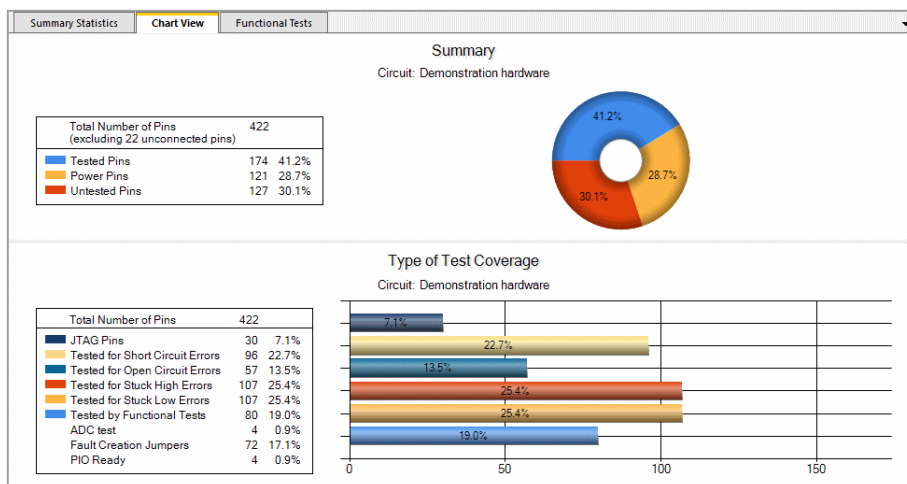
レイアウトビューアの表示速度が改善され、プロジェクトファイルをすばやく開いて、よりスムーズにナビゲーションができるようになりました。また視覚的な解像度がよりシャープになり、エンジニアが潜在的な障害を迅速に特定することに役立ちます。





3.テストカバレッジの強化

テストごとにカバレッジを最大限にするために必要な分析を行うことができます。またレポートには業界標準の PCOLA / SOQ アプローチを使用して、欠陥の範囲を評価できるようになりました。



XJTAG v3.8 では、テスト開発者だけでなくハードウェアエンジニアも、Waveform Viewer を使用して回路の動作を簡単に視覚化できます。より詳細な情報で障害を正確に指摘し、Layout Viewer を直感的にナビゲートし、テストカバレッジを正確に評価することで時間を短縮します。XJTAG v3.8 では、テストデータの処理と表示をより細かく制御できる、よりスマートで迅速なテスト開発エクスペリエンスを提供します。

XJTAG 社について

XJTAG 社は、JTAG バウンダリスキャンテストツールの世界にイノベーションを起こしたリーディング・サプライヤであり、革新的な製品開発と高品質な技術サポートに重点を置いています。XJTAG 製品は、IEEE Std.1149.x (JTAG バウンダリスキャン) を使用して、エンジニアが電子回路を迅速かつ簡単にデバッグ、テスト、不良解析、およびプログラムできるようにします。これにより、電子設計、開発、製造プロセスが大幅に短縮されます。同社、その製品およびそのサービスに関する詳細は、www.xjtag.com をご覧ください。



富士設備工業株式会社 電子機器事業部

www.fuji-setsu.co.jp

